

Nature de la prestation de services et domaine :

Caractérisation

Spectrométrie de photoélectrons_XPS

Photo de l'équipement :



Détails sur les services à fournir et caractéristiques :

La spectrométrie photoélectronique X, ou spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X (en anglais, X-Ray photoelectron spectrometry : XPS) est une méthode de spectrométrie photoélectronique qui implique la mesure des spectres de photoélectrons induits par des photons de rayon X. Dans l'XPS, l'échantillon est bombardé par des rayons X d'une certaine longueur d'onde (issus de sources $AlK\alpha$ et ou Al/Mg), ce qui émet un photoélectron qui est par la suite détecté. Les photoélectrons ont des énergies propres à chaque élément, ce qui permet de déterminer la composition de l'échantillon. Pour une analyse qualitative, l'élément doit avoir une concentration plus élevée que 0,1%, tandis qu'une analyse quantitative peut être effectuée si 5% de l'élément est présent. La méthode était anciennement nommée ESCA (electron spectroscopy for chemical Analysis : Spectroscopie d'Electron pour l'Analyse Chimique).

Applications :

Les spectromètres XPS Thermo Scientific sont la solution pour vos analyses d'interface, de film mince et de surface les plus complexes.

- Ils permettent aux scientifiques à la pointe de la science des matériaux de connaître d'importantes avancées dans le domaine du développement de films ultra-minces et de nanotechnologies.

Coordonnées du contact : (Organisme, tel, email)

Centre de *Recherche en Technologie des Semi-conducteurs pour l'Énergétique* (CRTSE)
Département des *Equipements Scientifiques de Réalisation et Caractérisation des Dispositifs à Semi-conducteurs*.

Tel. / Fax. : +213 (0)23 49 56 29 / +213 (0)23 49 58 88

Email : commercial@crtse.dz